

RDS100-24

RELIABILITY DATA

信頼性データ

DWG No. B029-57-01		
APPD	CHK	DWG
<i>Kurozawa</i> 9. Mar. '10	<i>Shima mune</i> 9. Mar. '10	<i>Masuyata</i> 8. Mar. '10

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	R-1
2. 部品デイレートイング Component Derating	R-2~3
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	R-4
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	R-5
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	R-6
6. 振動試験 Vibration Test	R-7
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	R-8

※ 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は実力値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be
actual capability data because all units have nearly the same characteristics.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : RDS100-24-24

(1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102, RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。
 それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。
 Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102, RCR-9102B).
 Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated
 by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間(Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数/10⁶時間)
 Total Equipment Failure Rate (Failure/10⁶Hours)

λ_G : i番目の同属部品に対する故障率 (故障数/10⁶時間)
 Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure/10⁶Hours)

N_i : i番目の同属部品の個数
 Quantity of ith Generic Part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数
 Number of Different Generic Part Categories

π_Q : i番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)
 Generic Quality Factor for The ith Generic Part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF Values

 G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102

MTBF ≒ 221,065 時間 (Hours)

RCR-9102B

MTBF ≒ 107,013 時間 (Hours)

2. 部品デイレートイング Components Derating

MODEL : RDS100-24-5

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	: 標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature	: 50°C
・入力電圧 Input voltage	: 24VDC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	: 5V, 20A

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated
based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within
derating criteria.

(d) 熱抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(\max)} - T_c}{P_{c(\max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(\max)} - T_{a'}}{P_{c(\max)}}$$

T_c : デイレートイングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

$T_{a'}$: デイレートイングの始まる周囲温度 一般に25°C
Ambient Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

$P_{c(\max)}$: 最大コレクタ(チャンネル)損失

($P_{ch(\max)}$) Maximum Collector (channel) Dissipation

$T_{j(\max)}$: 最大接合点(チャンネル)温度

($T_{ch(\max)}$) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャンネル)からケースまでの熱抵抗

(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

θ_{j-a} : 接合点(チャンネル)から周囲までの熱抵抗

(θ_{ch-a}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Ambient

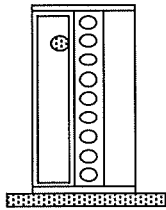
(2) 部品デレーティング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	$V_{in} = 24VDC$	Load = 100%	$T_a = 50^{\circ}C$
Q1 2SK3271-01 FUJI ELECTRIC	$T_{ch}(\max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 190.9 \text{ mW}$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 79.0^{\circ}C$ D.F. = 52.7 %	$\theta_{ch-c} = 0.806^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 28.8^{\circ}C$	$P_{ch}(\max) = 155 \text{ W}$ $T_c = 78.8^{\circ}C$
Q101 SSM3K7002F TOSHIBA	$T_{ch}(\max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 0.86 \mu W$ $T_{ch} = T_a' + ((\theta_{ch-a}) \times P_{ch}) = 82.7^{\circ}C$ D.F. = 55.1 %	$\theta_{ch-a} = 625^{\circ}C/W$ $\Delta T_a = 32.7^{\circ}C$	$P_{ch}(\max) = 200 \text{ mW}$ $T_a' = 82.7^{\circ}C$
Q106 2SC2712-Y TOSHIBA	$T_{ch}(\max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 3.4 \text{ mW}$ $T_{ch} = T_a' + ((\theta_{ch-a}) \times P_{ch}) = 94.5^{\circ}C$ D.F. = 63.0 %	$\theta_{ch-a} = 667^{\circ}C/W$ $\Delta T_a = 42.2^{\circ}C$	$P_{ch}(\max) = 150 \text{ mW}$ $T_a' = 92.2^{\circ}C$
D104 1SS184 TOSHIBA	$T_j(\max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 12.7 \text{ mW}$ $T_j = T_a' + ((\theta_{j-a}) \times P_d) = 105.9^{\circ}C$ D.F. = 70.6 %	$\theta_{j-a} = 833^{\circ}C/W$ $\Delta T_a = 45.3^{\circ}C$	$P_d(\max) = 150 \text{ mW}$ $T_a' = 95.3^{\circ}C$
D201 1SS184 TOSHIBA	$T_j(\max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 45.1 \text{ mW}$ $T_j = T_a' + ((\theta_{j-a}) \times P_d) = 119.5^{\circ}C$ D.F. = 79.7 %	$\theta_{j-a} = 833^{\circ}C/W$ $\Delta T_a = 31.9^{\circ}C$	$P_d(\max) = 150 \text{ mW}$ $T_a' = 81.9^{\circ}C$
PC101 PS2801-1 NEC	$T_j(\max) = 125^{\circ}C$ $P_d = 1.5 \text{ mW}$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 78.0^{\circ}C$ D.F. = 62.4 %	$\theta_{j-c} = 150^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 27.8^{\circ}C$	$P_d(\max) = 120 \text{ mW}$ $T_c = 77.8^{\circ}C$

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : RDS100-24-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method (標準取付 : A) (Standard Mounting : A)	Mounting A	Mounting B
		
入力電圧 Input Voltage (VDC)	24	
出力電圧 Output Voltage (VDC)	5	
出力電流 Output Current (A)	20	

(2) 測定結果 Measuring Results

出力デレーティング Output Derating (%)		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}\text{C}$)	
		100 (100W)	
		Ta=50 $^{\circ}\text{C}$	Ta=40 $^{\circ}\text{C}$
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B
PS1	POWER MODULE	35.3	37.3
Q1	MOS FET	28.8	29.6
Q101	MOS FET	32.7	32.8
Q106	TRANSISTOR	42.2	42.6
D201	DIODE	31.9	31.2
PC101	PHOTO COUPLER	27.8	26.8
L1	BALUN COIL	27.0	28.7
L2	BALUN COIL	29.7	31.4
T1	TRANS	30.4	30.8
C3	E. CAP.	19.7	20.0
C4	E. CAP.	21.3	20.2
C51	E. CAP.	26.3	24.7

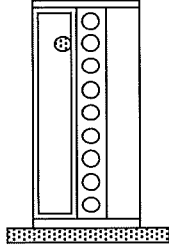
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : RDS100-24-5

空冷条件 : 自然空冷

Cooling Condition : Convection Cooling

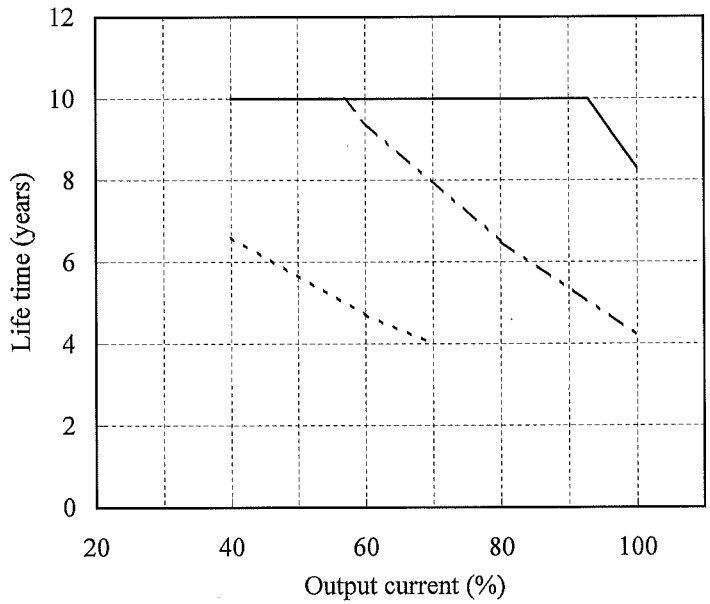
取付方向 A
Mounting A



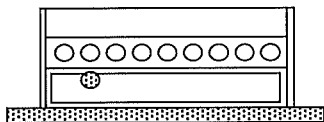
Vin=24VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	10.0	6.6
60	10.0	9.4	4.7
80	10.0	6.5	-
100	8.3	4.2	-

Conditions Ta 40°C : ———
50°C : - · - · -
60°C : - - - - -



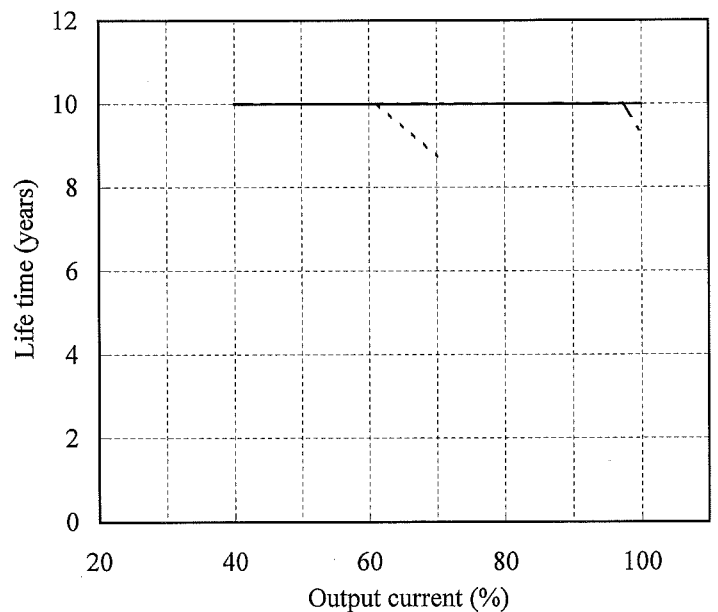
取付方向 B
Mounting B



Vin=24VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	10.0
80	10.0	10.0	-
100	10.0	9.3	-

Conditions Ta 30°C : ———
40°C : - · - · -
50°C : - - - - -



5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : RDS100-24-5

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 32VDC Output : Rating Ta : R.T.

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode		Test result												Note	
	Location No.	Test point	Short	Open	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l		
					Fire	Smoke	Burst	Smell	Red hot	Damaged	Fuse blown	O.V.P.	O.C.P.	No output	No change	Others		
1	Q1	D-S	○												○			
2		D-G	○							○					○		Da : TFR1	
3		G-S	○							○					○		Da : TFR1	
4		D		○						○					○		Da : TFR1	
5		S		○						○					○		Da : TFR1	
6		G		○						○					○		Da : TFR1	
7	D1	A-K	○								○				○			
8		A		○											○			
9		K		○											○			
10	C3		○								○				○			
11				○											○			
12	C51		○										○					
13				○												○	Output ripple increase	
14	TFR1		○												○			
15				○											○			
16	T1	1-2	○												○			
17		1		○											○			
18		3		○											○			
19	PS1	+Vin - -Vin	○								○				○			
20		+V - -V	○										○					
21		-S - TRM	○												○			
22		TRM - PC	○										○					
23		PC - IOG	○													○		
24		IOG - AUX	○													○		
25		+Vin (-Vin)		○												○		
26		SG		○												○		
27		CNT		○												○		
28		+S		○									○					
29		+V (-V)		○												○		
30		-S		○													○	Output voltage decrease
31		TRM		○													○	Output voltage increase
32		PC		○													○	
33		IOG		○													○	
34		AUX		○													○	

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : RDS100-24-12

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

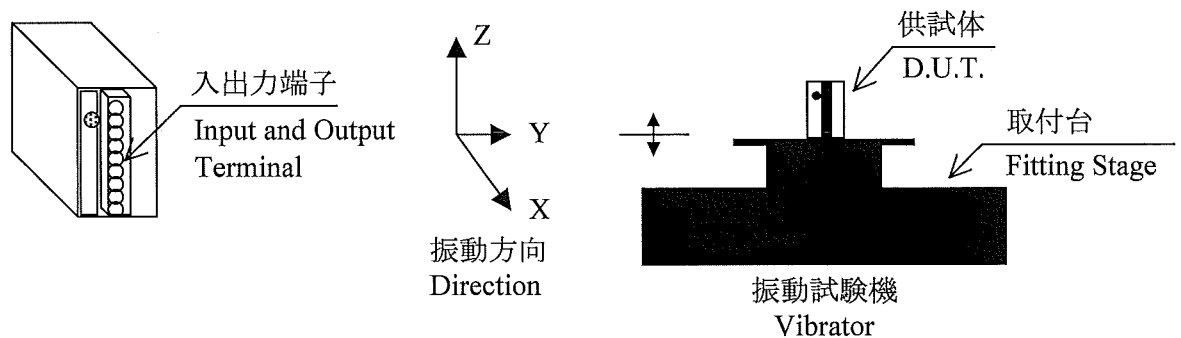
(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株) 製
EMIC CORP・制御部 : F-400-BM-E47
Controller・加振部 : 905-FN
Vibrator

(3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 10~55Hz	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・掃引時間 Sweep time	: 1.0min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each
・加速度 Acceleration	: Constant 19.6m/s ² (2G)		

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事
Not to be broken
2. 試験後の特性は初期値から変動していない事
Characteristic to be within regulation specification after the test.

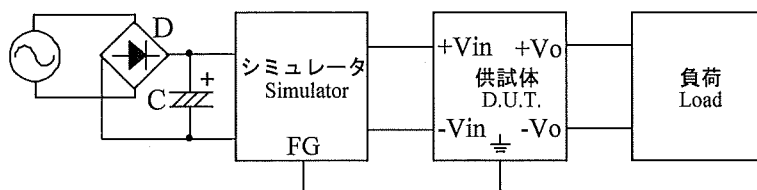
(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : RDS100-24-5

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| ・ シミュレータ Simulator | : INS-4320(A) | (ノイズ研究所)
(Noise Laboratory Co.,LTD) |
| ・ ブリッジダイオード (D)
Bridge Rectifier | : PGH758A | (日本インター)
(NIHON INTER) |
| ・ 電解コンデンサ (C)
Electrolytic Cap. | : 250V 15000 μ F | |

(2) 試験条件 Test Conditions

- | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| ・ 入力電圧
Input voltage | : 24VDC | ・ ノイズ電圧
Noise level | : Common 0V~2kV
Normal 0V~300V |
| ・ 出力電圧
Output Voltage | : 定格
Rated | ・ 極性
Polarity | : +, - |
| ・ 出力電流
Output current | : 0, 100% | ・ 印加モード
Mode | : コモン、ノーマル
Common, Normal |
| ・ 周囲温度
Ambient temperature | : 25°C | | |
| ・ パルス幅
Pulse width | : 50~1000ns | | |

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事
Not to be broken
2. 出力がダウンしない事
Not to be shut down output
3. その他異常のない事
No other out of orders

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK